



Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Corso di Laurea Magistrale in Ing. delle Nanotecnologie

Microscopie e Tecniche di Nanocaratterizzazione
Prof. Marco Rossi



Prova di esame dell'11 luglio 2014 – a.a. 2013-14

- 1) Descrivere le principali differenze tra un microscopio elettronico a trasmissione (TEM) e un microscopio elettronico a scansione.
- 2) Descrivere similitudini e differenze tra EDX (Energy-Dispersive X-ray spectroscopy) e XRF (X-Ray Fluorescence)
- 3) Quali sono i principali tipi di aberrazione in microscopia elettronica e che problemi comportano nelle diverse tecniche?
- 4) Descrivere i principali (almeno 3) misuratori di vuoto, specificandone i principi di funzionamento e l'intervallo operativo.
- 5) Illustrare la spettroscopia Raman e illustrarne vantaggi e limitazioni rispetto ad altre tecniche spettroscopiche conosciute.